

# MEMS可靠性



[MEMS可靠性\\_下载链接1](#)

著者:

出版者:

出版时间:2009-3

装帧:

isbn:9787564115753

《MEMS可靠性》是国际上MEMS可靠性领域第一本专著，共分为两部分。第一部分论述MEMS材料的可靠性内容及主要表征方法，包括MEMS材料的可靠性，微纳压痕仪，鼓胀测试，弯曲测试，单轴张应力测试，片上测试；第二部分论述MEMS器件的可靠性，包括压力传感器可靠性，惯性传感器可靠性，RFMEMS可靠性和光MEMS可靠性。内容新颖，数据充实，适合于微机电系统、微电子、光电子、传感器、通讯技术领域的高年级大学生、研究生和工程技术人员参考。

作者介绍:

目录:

[MEMS可靠性 下载链接1](#)

标签

评论

---

[MEMS可靠性 下载链接1](#)

书评

---

[MEMS可靠性 下载链接1](#)